

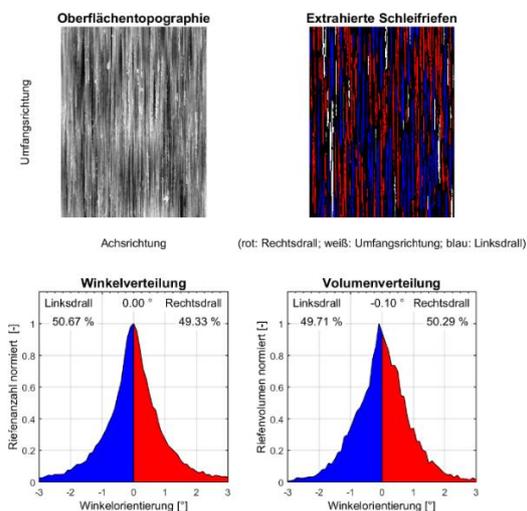
Bruker NPFLEX-LA

## Beschreibung:

- Das optische Messgerät ermöglicht eine quantitative Auswertung von Oberflächen
- Die Oberfläche wird mit fokussiertem Weißlicht beleuchtet welches mit Hilfe eines Referenz-strahlengangs zur Interferenz gebracht wird
- Aus dem Intensitätsprofil in Z-Richtung wird die Oberflächentopographie berechnet
- Das Messgerät zeichnet sich durch eine hohe Messgeschwindigkeit aus

## Technische Daten:

Auflösung in z-Richtung:	0,15 nm
Laterale Auflösung	max. 0,20 nm
Messprinzip	Weißlichtinterferometrie
Rotationsvorschub	ideal für zylindrische Untersuchungsoberfläche



*Mikrodralldarstellung*

## Untersuchungsmöglichkeiten

- Normgerechte Bestimmung von Oberflächenkennwerten nach
- DIN EN ISO 4287/4288 möglich
- Eine Rotationseinheit ermöglicht die Vermessung von Drallstrukturen auf Wellenoberflächen
- Vermessen von Abstände, Tiefen, Volumen und Geometrien
- Schadensanalyse: Kratzer, Fehlstellen, etc.
- Verschleißmessungen, Laufspurverschleiß eines RWDR auf einer Welle, etc.